

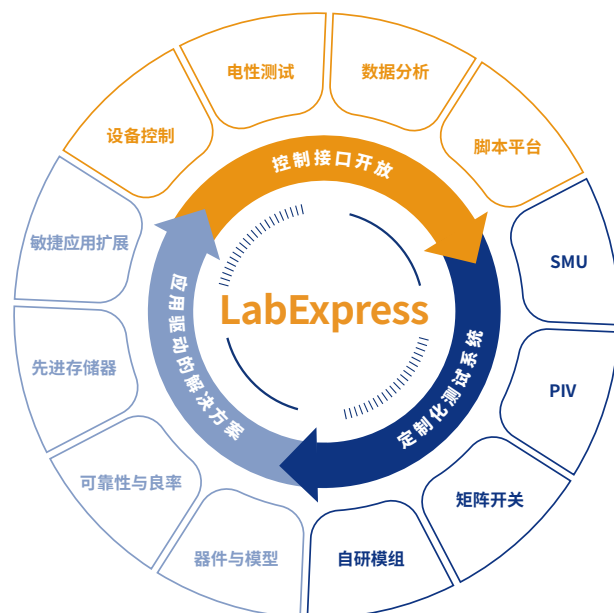
灵活易用电性参数测试软件

产品简介

LabExpress 电性参数测试软件是针对半导体器件研发与生产环境中的电性参数测试应用而设计的一款专业 EDA 工具，可协同控制概伦硬件设备、第三方测试仪表、探针台和测试仪器接口等，通过用户友好的图形界面支持了广泛的测试设备，具备强大的测试分析和灵活的自定义能力。

该软件的社区版本供用户免费使用，支持包括 FS-Pro、FS800，以及 981X 系列产品在内的概伦测试仪器以及完整功能。您可以使用预置模板快速完成测试，也可以为复杂的实验编写自定义测试算法和流程，测试结果可以在多个窗口显示并通过灵活的表达式和算法进行结果分析。

软件还提供面向自动量测解决方案的 ATS 版本。该版本针对自动量测场景进行了深度优化，可支持晶圆映射和海量数据管理，控制多种型号的探针台、矩阵开关和第三方设备进行自动测试，同时支持众多专业化应用，提升自动化测试分析的效率和使用体验。



技术规格

• 完整的待测器件类型

MOSFET、BJT、二极管、电阻、电容、可寻址型器件以及自定义类型器件

• 丰富的内置测试算法

直流 IV、脉冲 IV、瞬态时域 IV、快速脉冲 IV、任意波形发生与测试、电容测试、噪声测试、开尔文四端法测试、多种可靠性测试 (例如 HCI、BTI、GOI 等，符合 JEDEC 标准)

• 便捷的信号生成和扫描

支持多种扫描类型，包括线性、对数、散点、多段、双向、带参数扫描等，内置多种信号生产函数，无需编程就可以实现复杂的测试波形信号

• 广泛的设备支持

- 支持全部概伦设备和完整测试功能，包括并行测试
- 支持多种第三方测试仪表
- 支持多种半自动和全自动探针台
- 支持通过 GPIB 接口和 LAN 接口控制更多的测试设备

• 灵活的算法流程

- 脚本化编程平台，无需编译和内存管理
- Java 风格的语法，便于理解算法，降低开发难度
- 完善的设备控制接口
- 定制测试流程和算法

• 晶圆级数据管理

- 图形化的晶圆映射编辑，快速创建测试计划
- 通过数据库管理数据，随时查看或进行二次处理
- 可将数据导出为 CSV 或 XLS 格式文件
- 可将数据导出为 BSIMProPlus 和 MeQLab 格式

产品应用

- 晶圆级电性参数测试
- 模型电学特性曲线测试
- 晶圆级可靠性测试
- 高吞吐量自动化测试

产品优势

- **直观易用**
 - 图形化界面直观便捷
 - 复杂设定一步直达,关键信息一览无余
- **功能强大**
 - 完整的待测器件类型
 - 丰富的内置测试算法
- **广泛支持**
 - 支持概伦全系列测试仪器以及完整功能
 - 支持主流探针台、矩阵开关和第三方测试设备
- **数据分析**
 - 内置多种数学计算公式,即时数据处理
 - 图像变换与叠加分析,距离、斜率等图像上测量
- **晶圆级测试**
 - 支持晶圆映射与测试计划创建
 - 支持晶圆级数据分析、管理、保存和随时调用
- **自定义扩展**
 - 内置脚本化编程平台支持自定义测试算法
 - 支持灵活的测试流程和复杂的数学计算分析

